

IGBT測試解決方案

提供世界最先進的功率器件測試，滿足大電壓(2000V)、大電流(6000A)產品測試需求，並支援KGD (Known Good Die) Chip測試，讓MCP(多晶片封裝)或SiP(系統級封裝)的良率提升，減少封裝成本因Bad Die所造成的浪費。

產品優勢

- ✓ 兼具AC和DC高電壓大電流測試系統
- ✓ 滿足多站式高溫 / 常溫測試並測需求

功能特色

- ✓ 使用簡易的填表式開發程式
- ✓ 滿足車載電子到功率器件測試不同需求

AC Test System

- MOSFET / IGBT的動態測試系統
- 具備能符合di/dt、dv/dt測試需求的波形分析功能
- 符合高速切換器件的測試需求
- 優越的極低寄生電感控制，以真實再現器件規格書的數據
- 內建Real Time偵測異常電壓、電流並執行快速切斷的保護功能
- 填表式程式開發工具(PIPG)，方便使用者快速開發程式

規格

- ✓ 可執行L-SW, RRSOA, RBSOA, SCSOA, Qg, Ava 等測試項目
- ✓ 電壓能力：1200V
- ✓ 電流能力：2400A (SCSOA : 6000A)



AC Test System



DC Test System

DC Test System

- 配置有閾值電壓測試(Vth)專用測試功能
- 對應大電流Vth、高電壓Vth、小電流Vth測試
- SLOT構造，維修檢查方便
- 高速大電流源
- 填表式程式開發工具(PIPG)，方便使用者快速開發程式

規格

- ✓ 可執行IGES, ICES, Bvces, VGE, VGSE, VCSE, ICSE, ISEC 等測試項目
- ✓ 電壓能力：2000V
- ✓ 電流能力：1600A

